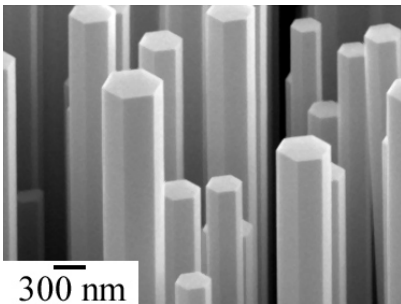


# GEMaC

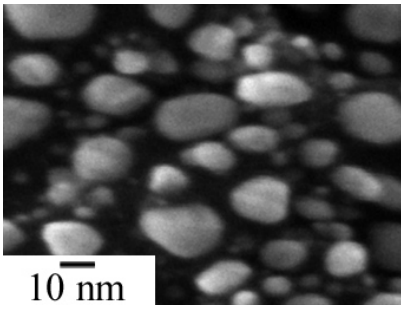
Groupe d'Étude  
de la Matière Condensée

## FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

Modèle : JEOL 7001F



*Nanofils de ZnO*



*Billes d'or nanométriques*

Détecteurs :

- » électrons secondaires : Everhart et Thornley
- » électrons rétrodiffusés : rétractable
- » cathodoluminescence : miroir parabolique rétractable

Spécifications :

- » source d'électrons à émission de champ : pointe Schottky
- » résolution ultime en électrons secondaires : 1,2 nm@ 30 kV et 3 nm@1 kV
- » résolution en conditions d'analyse : 3 nm@ 15 kV / 5 nA / WD 10 mm
- » tension d'accélération : 500 V à 30 kV
- » courant de faisceau : 1 pA à 200 nA
- » gamme de grandissement :  $\times 10$  à  $\times 1\,000\,000$